



FORM - 전자 부품과 어셈블리의 품질 관리를 위한 ATE의 개발 및 생산에 러시아 최고 업체 — FORMULA® 테스트 시스템.

34 Ochakovskoe highway,
Moscow, Russia 119530
전화: +7 (495) 269-75-90
+7 (495) 269-75-91
팩스: +7 (495) 269-75-94
이메일: info@form.ru
웹 사이트: www.form.ru

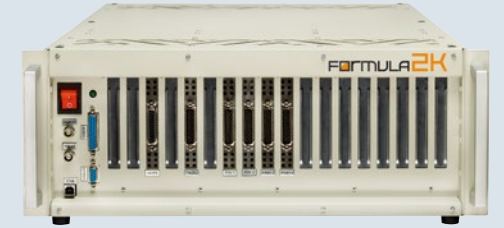
FORMULA® HF ULTRA	FORMULA® HF3 / HF3-512	FORMULA® 2K
550MHz/1024핀	200MHz/512핀	20MHz/256핀

마이크로회로 기능 테스트 및 매개변수 테스트용 테스트 시스템

디지털 VLSI 회로: FPGA, ASIC, 마이크로프로세서 및 마이크로컨트롤러, 정적 및 동적 메모리, VLSI SoC, ADC 및 DAC, SiP.

디지털 VLSI 회로: FPGA; ASIC, 마이크로프로세서, 마이크로컨트롤러, 정적 및 동적 메모리, ADC 및 DAC, RFID.

디지털 LSI 회로 및 집적 마이크로회로: 하드 와이어드 로직, FPGA, ASIC, 마이크로컨트롤러, RAM, 아날로그 집적 마이크로회로: DAC 및 ADC, 연산증폭기, 비교기, 스위치, 스테빌라이저.



최소 펄스 지속시간	최대 550MHz					최대 200MHz		최대 20MHz		
기능 테스트 주파수	800ps					1.65ns		지정되지 않음		
최소 펄스 상승/하강 에지 지속시간	275ps					0.7ns		4ns		
양방향 핀 수	최대 1024개					최대 512개		최대 256개		
벡터/오류 메모리	128M/128M					64M/64M		1M/1M		
로직 레벨 범위	-1.5...+6.5V					-2...+7.5V		-10...+10V		
핀별 매개변수 측정 장치(PPMU)	최대 1024, -2...+13V					512, -2...+8V		없음		
PMU 수	최대 32개					최대 16개		최대 4개		
PMU 전압 범위	-2...13V					-2...+8V		-20...+20V		
PMU 전류 범위	±150mA					±150mA		±200mA		
측정 신호원 수	최대 32개	최대 32개	최대 8개	2	1	최대 16개		최대 4개	최대 4개	최대 4개
측정 신호원 전압 범위	0...+6 V	-2...+15 V	-17...+17 V	0...+4.5 V	0...+3.5 V	0...+6 V	-2...+15 V	-20...0 V	0...+20 V	-8...8 V
측정 신호원 전류 범위	-4...+4 A	-400...+400 mA	-500...+500 mA	-20...+20 A	-50...+50 A	-4...+4 A	-400...+400 mA	-2...+2 A		
DAC 및 ADC 마이크로회로 측정	최대 16비트 DAC 및 ADC의 정적 매개변수, 14비트/260MHz ADC의 동적 매개변수 측정용 ARP 모듈 1200MHz/1200MOPS/24비트					최대 14비트 DAC 및 ADC 정적 매개변수 측정용 PRIMA 어댑터		최대 12비트 DAC 및 ADC 정적 매개변수 테스트용 IZMER 정밀 측정 모듈		
BIST 기술	FPGA의 구성 파일 채우기용 통합형 JTAG 포트, STAPL 언어 지원 포함 통합형 JAM 플레이어									

FORMULA® TT2		FORMULA® R		FORMULA® CK	
2000 V / 100 A / 50 μs		800 V / 0.5 A / 0...300 ms		192 pins / 20MHz / ±30 V	
반도체 소자의 정적 매개변수 테스트 및 측정		MIL-PRF-39016에 따른 저전류 DC 전자기 릴레이 테스트 및 측정		전자 장비 모듈 및 어셈블리 테스트 및 진단	
트랜지스터, 스테빌라이저 다이오드, 사이리스터, 다이오드, 옴토 커플러		저전류 전자기 릴레이, 저항기 어셈블리		전자 장비 및 현장 교환 장치의 디지털 및 아날로그 어셈블리	
					
전압원	5개: 10V, 20V, 200V, 500V, 2000V	권선 수	1...8권선/500mA/120V	에지 터미널 테스트용 양방향 채널 수	192개
전류원	4개: 5mA, 200mA, 10A, 100A	접점그룹 수	1...12개	기능 테스트 주파수	20MHz
저전류 모드	0.2nA부터	전압/절연 저항	최대 800V/10GΩ	벡터/오류 메모리	1M/1M
펄스 지속시간	300μs...100s	권선저항	3Ω... 100kΩ	핀당 로직 레벨 범위	-30...+30V
시간 분해능	50μs	접촉저항	1mΩ...100Ω	PMU 전압 범위	-20...+20V
워크스테이션 수	1개 또는 2개	시간 분해능	0.8μs	PMU 수	2
GOST에 따라 준비된 측정 방법 수	65가지	활성화/해제 시간	0.03...300ms	측정 신호원 전압 범위	-30...+30V
미달 온도 테스트용 스위치	최대 20개의 반도체 소자에 대한 동시 그룹 온도 테스트	바운스 시간	0.01...300ms	측정 신호원 수	6개
		활성화/해제 시간 다이버시티	0...300ms	측정 신호원 전류 범위	-2...+2A
		접점 개폐 시간	0...300ms	외부 기기 제어용 스위치	192개 채널 중 하나에 외부 기기를 최대 4개까지 연결
		워크스테이션 수	1개 또는 2개	회로내 매개변수 및 기호 분석기 채널	1
				외부 오실로스코프 동기화 채널	2